



Seminario

Materiales escala nano mediante perfilometría óptica 3D

Pro-Lite Technology Iberia, junto con su socio tecnológico Sensofar Metrology, le invitan a participar en la jornada de "**Materiales escala nano mediante perfilometría óptica 3D**". Esta jornada va dirigida a todos aquellos que utilizan o estén pensando en utilizar perfilometría óptica para la caracterización de materiales y que deseen conocer las nuevas tendencias en este campo.

Programa

- 9:45** Entrega acreditaciones
- 10:00** Introducción
- 10:30** Técnicas de metrología óptica: Confocal, Interferometría y Variación de Foco
- 11:00** Nuevos métodos de medida y hardware: confocal continuo y variación confocal
- 11:30** Aplicaciones
- 12:00** Fin de la jornada



20 Junio 2017



Ubicación:

SCSI – Servicio Central de Instrumentación Científica
Universidad Jaume I
Edificio de Investigación
Campus del Riu Sec, Castelló de la Plana



Regístrese en
info@pro-lite.es

Organizadores

PRO-LITE
TECHNOLOGY

SENSOFAR.
METROLOGY


UNIVERSITAT
JAUME·I